

パーティクルカウンタ

■ 表面汚染測定器QⅢ

● QⅢは表面上の粒子をわずかに数秒で測定



品番 QⅢMax



品番 QⅢUltra

<特徴>

- 数秒で(QⅢMax)0.3 μ m以上(QⅢUltra)0.1 μ m以上の粒子を検知
- 多様なプローブ形状ラインナップで測定困難箇所を簡便

«このような方に最適»

- ・クリーンルーム内にある各種製造装置に用いられる構成部品を洗浄した後、その洗浄度を確認
- ・従来の洗浄度確認方法では時間が掛かり過ぎる
- ・従来の方法では洗浄度の確認が困難な箇所を調べたい
- ・クリーニングの手順と基準を定量的に規定したい
- ・発塵源の特定などのトラブルシューティング

■ 多彩なプローブ形状



| | QⅢMax | QⅢUltra |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 粒径表示 (μ m) | 6チャンネル 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0 | 6チャンネル 0.1/0.2/0.3/0.5/1.0/5.0 |
| サイズ | 約360×340×230mm | 約360×580×230mm |
| 重量 | 約8.6kg | 約17.2kg |
| 入力電力 | 100~240 VAC 50/60Hz | |
| ディスプレイ | 7インチWVGA(タッチパネル式) | |
| GUI | Windows CE | |
| センサー | 光散乱方式(0.3 μ m~)半導体レーザー仕様 | 光散乱方式(0.1 μ m~)HeNeレーザー仕様 |
| 出力 | USB | |
| プローブフェイスプレート | VespeI | |

■ ハンドヘルドパーティクルカウンタ

● 基本性能を確保し、計測する人に使い易さをご提供

■ KC-51

- 粒子区分 0.3、0.5、5.0 μ m
- 3.2インチモノクロ液晶パネル
- USB端子を搭載

■ KC-52

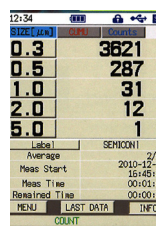
- 粒子区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μ m
- パスワードの設定により、管理者と使用者とで操作内容を区別
- 表示言語は日本語、英語を選択可能
- USB端子、SDカードスロットを搭載
- 多点モニタリングシステムに対応

■ タッチパネル式の多機能なKC-52、リーズナブルなKC-51の2機種

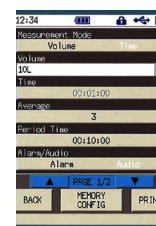
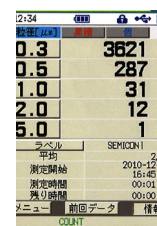
- ・ISO21501-4 (JISB9921)に適合 さまざまな洗浄管理に適します。
- ・環境に優しい充電電池(リチウムイオン電池)を使用
- クリーンルームの洗浄度管理
- 半導体製造現場の環境管理
- 製薬、医療現場の洗浄度管理



KC-51
2段階画面例



KC-52 画面例



品番 KC-51・KC-52

| | KC-51 | KC-52 |
|-------------|--|-----------------------------------|
| 光源 | 半導体レーザー(波長780nm、定格出力35mW) | |
| 定格流量 | 2.83L/min | |
| 粒径区分 | 3段階:0.3、0.5、5.0 μ m以上(初期値) 2段階:0.3、0.5 μ m以上 2段階:0.5、5.0 μ m以上 | 5段階:0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μ m以上 |
| 最大粒子個数濃度 | 140,000,000 個/ml (計数損失10%以内) | |
| サンプリングチューブ径 | 外径: ϕ 8mm、内径: ϕ 6mm | |
| 電源 | 内蔵型リチウムイオン電池または、ACアダプタ AC100V~240V、50/60Hz | |
| 大きさ・重さ | 304(H)×87(W)×55(D)mm 約780g | |

※その他、オプション・付属品等、詳細につきましてはお問い合わせください。

ステレンス・チェア
測定器